Kazimierz Korbel

Ekstrakcja informacji z sygnału radiometrycznego.

(Monografia w opracowaniu na prawach rękopisu)

Kraków 2000 -

1. Wprowadzenie.

Mianem *sygnału radiometrycznego* nazywać będziemy strumień *promieniowania jonizującego* (*jądrowego*) opisany zespołem (uwarunkowanych procesem generacji promieniowania) jego inherentnych parametrów deskryptywnych, modyfikowanych efektami oddziaływania (absorpcja, rozpraszanie, konwersja i i.) z medium transmisyjnym. Sygnał radiometryczny jest w tym kontekście nośnikiem szeregu informacji dotyczących źródła promieniowania jak również własności interaktywnego ośrodka. Zadaniem *radiometrycznego systemu pomiarowego* jest wydobycie (*ekstrakcja*) z sygnału zawartej w nim pożądanej informacji z możliwie jak najwyższą dokładnością estymacji.

Stochastyczny charakter sygnału radiometrycznego implikuje wykorzystanie w tym procesie statystycznych metod estymacji wyznaczanych wielkości [1],[2]. Metody te stanowią zresztą podstawę współczesnych teorii systemów pomiarowo-informacyjnych [3], spośród których za szczególnie bliską zagadnieniom transportu sygnału radiometrycznego [4] należy uznać *statystyczną teorię komunikacji* [5].

Skonstruowany w konwencji pojęć tej teorii uogólniony schemat pojedynczego toru pomiarowego systemu radiometrycznego daje się przedstawić w postaci pokazanej na rysunku 1.



Rys.1. Uogólniony schemat blokowy radiometrycznego toru pomiarowego. [Kursywą podano oznaczenia wg terminologii radiometrycznej]

Wobec niezgodności terminologicznej oznaczeń poszczególnych bloków funkcjonalnych stosowanych w dziedzinie radiometrii oraz w technice transmisji i przetwarzania sygnałów, na powyższym schemacie podano również kilka oznaczeń alternatywnych. Szczególna rozbieżność znaczeniowa dotyczy terminu "DETEKTOR", który w sferze definicyjnych określeń statystycznej teorii komunikacji nadano układowi stwierdzającemu istnienie lub brak sygnału (względnie określonych jego cech) na tle towarzyszących zakłóceń szumowych. W dziedzinie fizyki jądrowej tego rodzaju układ zwany jest ogólnie "TRYGER'em" przybierającym, stosownie do realizowanych funkcji, bardziej uszczegółowione nazwy. I *vice versa*, ugruntowana w domenie fizyki jądrowej nazwa "DETEKTOR" (czujnik promieniowania) w alternatywnej terminologii objęta jest terminem o szerszym zakresie znaczeniowym - "RECEPTOR" (odbiornik sygnału). Termin ten pojęciowo odpowiada bardziej określeniu "BLOK ELEK-TRONIKI FRONT-END" [6], którym to mianem przyjęto zwać tandem konstrukcyjnie zwią-

zanych jednostek funkcjonalnych: czujnika promieniowania, konwertującego *nieelektryczny* sygnał radiometryczny w proporcjonalny sygnał *elektryczny* i preprocesora analogowego, dokonującego wstępnego wzmocnienia i formowania sygnału elektrycznego.

Obydwa procesy przetwarzania sygnału obciążone są różnej natury zaburzeniami zarówno wewnętrznymi (szumy, interferencje) jak i zewnętrznymi (zakłócenia indukowane). Wynika stąd konieczność *uzdatniania sygnału* (tj. odpowiedniego przystosowania do dalszego procesowania) przed przekazaniem go do gałęzi DETEKTORA i EKSTRAKTORA. Operacje takiego uzdatniania noszą nazwę *kondycjonowania sygnału*, a służące temu celowi układy elektroniczne zwane są ogólnie KONDYCJONERAMI* [7]. Pojęciem tym obejmowane są w zasadzie również układy *preprocessingu* sygnału; w obszarze systemów pomiarowych elektroniki jądrowej zostały one jednak wyodrębnione pod ugruntowaną już w praktyce nazwą układów ELEKTRONIKI FRONT-END.

W wyniku konwersji *sygnału radiometrycznego* (w bloku ELEKTRONIKI FRONT-END) zawarte w nim informacje są przejmowane przez wtórny *sygnał elektryczny* wyrażając się odpowiednio w jego parametrach deskryptywnych. Tak na przykład w najprostszym przypadku pomiaru radiometrycznego, tj. monitorowania natężenia promieniowania, odnośną informację stanowi średnia częstotliwość impulsów wyjściowych RECEPTORA. Przy braku dodatkowych uwarunkowań metrologicznych funkcja EKSTRAKTORA sprowadza się wówczas praktycznie do *detekcji binarnej* sygnału elektrycznego, czyniąc zbytecznym stosowanie osobnego bloku funkcjonalnego.

Bardziej rozbudowane układy ekstracji informacji wymagane są w dziedzinie pomiarów spektrometrycznych i identyfikacyjnych, a zwłaszcza w systemach wieloparametrowej i wielopoziomowej selekcji zdarzeń. Rodzaj ekstrahowanej z sygnału informacji decyduje zarazem o charakterze niezbędnego kondycjonowania. Z tego powodu zasadniczy wykład dotyczący ściśle problematyki ekstrakcji informacji poprzedzono zwięzłym omówieniem najważniej-szych układów kondycjonujących stosowanych w spektrometrycznych systemach pomiarowych. Specyfika pomiarów radiometrycznych, a spektrometrycznych w szczególności skłania jednak do poszerzenia zakresu znaczeniowego terminu KONDYCJONOWANIE o działania blokujące (wstrzymujące) procesowanie sygnału w określonych przypadkach ekstremalnych.

2. Kondycjonowanie sygnału radiometrycznego.

Podstawowymi operacjami *kondycjonującymi* sygnał radiometryczny, wobec jego obciążenia szumowego i relatywnie niskiego poziomu, są operacje *wzmacniania* i *filtracji*. W torze spektrometrycznym obie te operacje dokonywane są w układzie *wzmacniacza formującego* (ang. *shaping amplifier*). zawierającego obok aktywnych stopni wzmacniających zespół filtrów górno- i dolno-przepustowych. Problematyce filtracji sygnału poświęcono osobną, opracowaną w formie skryptu uczelnianego AGH [8] monografię; do tej pozycji odsyłamy więc zainteresowanego czytelnika.

Rodzaj i zakres kondycjonowania w strukturze wzmacniacza spektrometrycznego wynika z ogólnych, nakładanych nań wymagań. Dotyczą one podstawowych własności wzmacniacza opisywanych przez jego charakterystyki i parametry znamionowe. Pożytecznym będzie więc przypomnieć w skrócie najważniejsze.

^{*)} Termin ten funkcjonuje od wielu już lat w dziedzinie elektroniki i automatyki przemysłowej, nie upowszechnił się jednak – jak dotąd – w obszarze elektroniki jądrowej

2.1. Parametry i charakterystyki – Glosariusz.

Podstawowym żądaniem stawianym generalnie torom pomiarowym jest wysoka liniowość ich przenoszenia. Za miarę tej własności wzmacniaczy przyjęto parametry określające odpowiednio *globalne* i *lokalne* odstępstwo charakterystyki przenoszenia od przebiegu idealnie liniowego.

Parametrem globalnym opisującym nieliniowość wzmacniacza jest tzw. *współczynnik nieliniowości całkowej* ε_i . W terminach relacji napięciowej z mocy definicji wyraża się on zależnością :

$$\varepsilon_i \stackrel{def}{=} \frac{\Delta V_o}{V_{pMAX}} \tag{1}$$

gdzie $\Delta V_{o.max}$ oznacza maksymalne odchylenie charakterystyki przejściowej od idealizowanego przebiegu liniowego, zaś $V_{o max}$ maksymalną wartość nominalną odpowiedzi.

W praktyce metrologicznej stosowane są trzy sposoby określania odchyłki ΔV_o . Zilustrowano je na rysunku 2.



Rys.2. Sposoby określania nieliniowości całkowej wzmacniacza.

Najbardziej upowszechnił się sposób, w którym ΔV_o stanowi *naturalną*, maksymalną odległość punktów charakterystyki *rzeczywistej* i *idealnej* (ΔV_{oA}) leżących na wspólnej rzędnej, przy czym referencyjną charakterystykę idealną reprezentuje prosta (A) przechodząca przez skrajne punkty charakterystyki *rzeczywistej*. Drugi sposób przyjmuje za odniesienie prostą (B) równoległą do (A), stanowiącą *symetralną* punktów charakterystyki rzeczywistej (ΔV_{oB}). Według tego sposobu wyznaczana jest nieliniowość całkowa urządzeń systemu aparaturowego "STANDARD". Najrzadziej stosowany, trzeci sposób, za reprezentatywną odchyłkę (ΔV_{oC}) przyjmuje odległość między punktem przecięcia stycznej do charakterystyki rzeczywistej w "zerze" (C) z poziomem V_o max, a leżącym na wspólnej rzędnej punktem charakterystyki *rzeczywistej*. Ze względu na niezgodność wartości ε_i wyznaczanych różnymi sposobami dane katalogowe odnośnych urządzeń zawierają z reguły informację jakim sposobem w danym przypadku się posłużono.

Nieliniowość różniczkowa ε_d stanowi z kolei *parametr lokalny*, określający odstępstwo nachylenia *rzeczywistej* charakterystyki przejściowej (dV₀/dV_i)_{rzecz} od nachylenia charakterystyki *idealnej* $(dV_o/dV_i)_{ideal}$ w punkcie aktualnej wartości wymuszenia $V_{i,m}$. Określa ona poziom zniekształcenia małych różnic amplitud sygnałów Z mocy definicji wielkość tę opisuje wyrażenie

$$\varepsilon_{d}(V_{i}) \stackrel{def}{=} \frac{\left(\frac{dV_{o}}{dV_{i}}\right)_{ideal} - \left(\frac{dV_{o}}{dV_{i}}\right)_{rzecz}}{\left(\frac{dV_{o}}{dV_{i}}\right)_{ideal}} = \frac{tg \,\alpha - tg \,\beta}{tg \,\alpha}$$
(2)

gdzie tg α i tg β reprezentują odpowiednio nachylenia charakterystyki idealnej (ściśle liniowej) oraz stycznej do charakterystyki rzeczywistej w punkcie $V_{i,m.}$, będące - jak to pokazano na rysunku 3 - geometrycznym odwzorowaniem współczynników wzmocnienia małosygnałowego.



Rys.3. Ilustracja definicji nieliniowości różniczkowej

Nieliniowość różniczkowa jest funkcją punktu pracy (poziomu względem którego kształtują się zmiany napięcia wejściowego). Dla jej oceny wymagana jest zatem znajomość funkcji (2) w całym obszarze dynamicznym wzmacniacza. Nie mniej jednak katalogi firmowe zamiast pełnej charakterystyki podają czasem maksymalną wartość nieliniowości różniczkowej. Nieliniowość wzmacniacza jest jednym z czynników powodujących dystorsję widma amplitudowego w systemach spektrometrii amplitudowej

W domenie czasu natomiast równie ważnymi parametrami są *czas opóźnienia* t_{op} oraz *czas narastania* t_n wzmacniacza. Wielkości te definiowane są na zasadzie różnych konwencji, podstawę których stanowią dwa rodzaje wymuszeń: *skokowego* (heaviside'owskiego) i *impulsowego* (dirakowskiego). Według ogólnie przyjętej umowy pod pojęciami *czasu opóźnienia wzmacniacza* jak i *czasu narastania wzmacniacza* należy rozumieć odpowiednie parametry *sygnału wyjściowego* wzmacniacza przy pobudzeniu skokowym lub impulsowym.

Tak więc zdefiniowany na gruncie wymuszenia skokowego *czas opóźnienia wzmacniacza* określa współrzędna czasowa punktu czoła odpowiedzi znajdującego się na połowie jego amplitudy $t_{50\%}$, co można zapisać jako

$$t_{op} = t_{50\%} \tag{3}$$

W tej samej konwencji *czas narastania wzmacniacza t_n* definiowany jest na dwa sposoby. Aktualnie powszechnie stosowany jest sposób przypisujący atrybut *czasu narastania* interwałowi zawartemu między współrzędnymi czasowymi punktów odpowiedzi na poziomie

dziesięciu (t_{10}) i dziewięćdziesięciu (t_{90}) procent jej wartości ustalonej. Definicja czasu narastania wzmacniacza według tego kryterium przybiera postać

$$t_n = t_{90} - t_{10}$$
 (4)

W praktyce pomiarowej funkcjonuje wywodząca się z powyższej postaci formuła wyznaczona dla przypadku prostego układu inercyjnego pierwszego rzędu o wartości górnej pulsacji granicznej ω_{3dB} , wiążąca w konsekwencji czas narastania z szerokością pasma przenoszenia Δf .

$$t_n = \frac{2.2}{\omega_{3dB}} \equiv \frac{0.35}{\Delta f}$$
(5)

Na zasadzie zadowalającego przybliżenia stosowana jest ona również do układów pasmowoprzepustowych pod warunkiem dostatecznie dużej odległości ich częstotliwości granicznych.

Druga definicja, oparta na założeniu wymuszenia skokowego, w terminologii anglosaskiej określana mianem "*slope definition*" (obecnie o raczej historycznym znaczeniu) aproksymuje czoło impulsu prostoliniowym odcinkiem stycznej do niego na poziomie połowy amplitudy (tzn. dla $t = t_{50}$). Opisuje ją wyrażenie

$$t_n^* \stackrel{def}{=} \frac{V_{o \max}}{\frac{dV_o}{dt}\Big|_{t_{50}}}$$
(6)

Konwencja przyjmująca za standardowy sygnał wymuszający *impuls dirakowski* definiuje obie wielkości *metodą momentów* funkcji odpowiedzi impulsowej h(t) wzmacniacza [9,10]. Metoda ta, korzystająca z formalizmu matematyki statystycznej, pozwala w prosty sposób wyznaczyć charakterystyczne parametry, określające własności dynamiczne dowolnego typu obiektu dynamicznego, zwane potocznie *uśrednionymi wskaźnikami dynamicznymi*. W ogólnym przypadku są nimi: *średni czas przejścia* "zaburzenia" t_{sr} i jego *dyspersja czasowa t_{dysp}*. w obiekcie, określone zależnościami.

$$t_{sr} = \frac{H_1}{H_o} \tag{7}$$

oraz

$$t_{dysp}^{2} \equiv \sigma_{t}^{2} = \frac{H_{2}}{H_{0}} - \left(\frac{H_{1}}{H_{0}}\right)^{2}$$
(8)

gdzie
$$H_k \stackrel{def}{=} \int_{0}^{\infty} t^n h(t) dt$$
 (9)

jest momentem k-tego rzędu funkcji odpowiedzi impulsowej h(t).

Oparty na wymuszeniu impulsowym sposób definiowania t_{op} i t_n wzmacniacza wyraża te wielkości przy pomocy uśrednionych wskaźników dynamicznych, utożsamiając czas opóźnienia ze średnim czasem przejścia impulsu

$$t_{op} \equiv t_{\acute{s}r} \tag{10}$$

a czas narastania wiąże z dyspersją czasową impulsu według relacji

$$t_n \equiv \sqrt{2\pi} t_{dysp} \tag{11}$$

Współczynnik skalujący $\sqrt{2\pi}$ w zależności (11) wprowadzono w celu uzgodnienia wyników obliczeń otrzymywanych różnymi sposobami [9].

Zauważmy, że obydwie wielkości (t_{op} i t_n) są oczywistymi funkcjami transmitancji F(p) wzmacniacza, można je zatem jednoznacznie opisać zespołem parametrów biernych transmitancję tę determinujących. Skorzystajmy w tym celu z podstawowej zależności

$$F(p) \equiv h(p) \stackrel{aeg}{=} \int h(t) e^{-pt} dt$$
(12)

Zastępując w niej człon wykładniczy jego rozwinięciem w szereg potęgowy

$$e^{-pt} = 1 - pt + \frac{p^2 t^2}{2!} - \frac{p^3 t^3}{3!} + \dots \dots \dots$$
(13)

oraz uwzględniając związek (8) otrzymujemy wyrażenie

$$F(p) = H_0 - H_1 p + H_2 \frac{p^2}{2!} - H_3 \frac{p^3}{3!} + \dots$$
(14)

ukazujące explicite powiązanie parametrów t_{op} i t_n z transmitancją wzmacniacza. W prostej konsekwencji prowadzi ono do wyznaczenia zależności czasu opóźnienia i czasu narastania od struktury wzmacniacza i wartości jego elementów pasywnych. Takie uzależnienie tkwi inherentnie w obwodowym równaniu opisującym przepustowość operatorową F(p), które w ogólnym przypadku daje się przedstawić jako iloraz dwu wielomianów

$$F(p) = \frac{a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots}{b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + \dots}$$
(15)

Na drodze elementarnych działań algebraicznych łatwo sprowadzić powyższe równanie do postaci o strukturze równania (14). Zadowalające przybliżenie zapewnia ograniczenie szeregu do jego trzech pierwszych składników :

$$F(p) = \frac{a_0}{b_0} + \left(a_1 - \frac{a_0 b_1}{b_0}\right) \frac{p}{b_0} + \left[\left(a_2 - \frac{a_0 b_2}{b_0}\right) - \left(a_1 - \frac{a_0 b_1}{b_0}\right) \frac{b_1}{b_0}\right] \frac{p^2}{b_0}$$
(16)

Porównanie współczynników przy takich samych potęgach zmiennej "p" w obu równaniach (14 i 16) prowadzi wprost do wyznaczenia szukanych zależności momentów charakterystyki impulsowej h(t) od wartości parametrów obwodowych

$$H_{0} = \frac{a_{0}}{b_{0}}$$
(17)

$$H_1 = \left(\frac{a_0 b_1}{b_0^2} - \frac{a_1}{b_0}\right)$$
(18)

$$H_{2} = 2\left[\left(a_{2} - \frac{a_{0}b_{2}}{b_{0}}\right) - \left(a_{1} - \frac{a_{0}b_{1}}{b_{0}}\right)\frac{b_{1}}{b_{0}}\right]\frac{1}{b_{0}}$$
(19)

Na gruncie przyjętej konwencji (6),(7),(10),(11) otrzymujemy ostatecznie

$$t_{op} = \frac{b_1}{b_0} - \frac{a_1}{a_0}$$
(20)

oraz

$$t_n = \left[2\pi \left\{ \left(\frac{b_1}{b_0} \right)^2 - \left(\frac{a_1}{a_0} \right)^2 + 2 \left(\frac{a_2}{a_0} - \frac{b_2}{b_0} \right) \right\} \right]^{\frac{1}{2}}$$
(21)

1

Praktyczna przydatność tych prostych relatywnie formuł jest jednak ograniczona do układów dolnoprzepustowych charakteryzujących się *monotoniczną charakterystyką skokową*. Współczynniki a_0 i b_0 transmitancji tej klasy układów (wzmacniaczy) są równe jedności, wobec czego równania od (15) do (21) ulegają znacznym uproszczeniom. W szczególności

$$t_{op} = b_1 - a_1 \tag{22}$$

$$t_n = \left\{ 2\pi \left[b_1^2 - a_1^2 + 2(a_2 - b_2) \right] \right\}^{\frac{1}{2}}$$
(23)

Rysunek 4 ilustruje podane wyżej definicje na przykładzie odpowiedzi kaskady czterech identycznych obwodów całkujących.



Rys.4. Ilustracja różnych sposobów definiowania czasu opóźnienia i czasu narastania wzmacniacza metodą wymuszenia skokowego (a) i impulsowego (b)

Zarówno czas opóźnienia jak i czas narastania należą do kategorii *parametrów małosygnałowych* wzmacniacza. Zalicza się do nich również, bardzo użyteczny w praktyce pomiarów spektrometrycznych, *czas osiągnięcia wartości szczytowej* impulsu wyjściowego formowanego w układzie filtru pasmowo-przepustowego wzmacniacza (ang. *peaking time*). Jak nietrudno wykazać [8], w ogólnym przypadku filtru typu (*CR*)-(*RC*)ⁿ (z jednym obwodem różniczkującym i *n* obwodami całkującymi) o identycznych stałych czasowych $\tau_i = \tau_d = \tau$, współrzędna czasowa szczytu impulsu t_{max} pozostaje w prostej relacji do stałej czasowej filtru

$$t_{max} = n\tau \tag{24}$$

Na kanwie przeglądu definicji podstawowych parametrów czasowych wzmacniacza wspomnieć wypada o jeszcze jednej - stanowiącej katalogowy parametr znamionowy scalonych wzmacniaczy operacyjnych - wielkości charakteryzującej szybkość reakcji wzmacniacza. Jest nią mianowicie *szybkość narastania odpowiedzi SR* (ang. *slew-rate*) zdefiniowana relacją

$$SR \stackrel{def}{=} \left(\frac{dV_o}{dt}\right)_{max}$$
(25)

W obszarze *małosygnałowym* wartość jej wyznaczają wartości elementów biernych układu oraz poziom wymuszenia, natomiast w warunkach pracy *wielkosygnałowe*j jest ona podyktowana wydajnością prądową (prądem nasycenia I_{nas}) dominującego elementu aktywnego (najczęściej stopnia wyjściowego struktury scalonej) i obciążającej go pojemności układowej C_o zgodnie z zależnością

$$SR = \left(\frac{dV_o}{dt}\right)_{max} = \frac{I_{nas}}{C_o}$$
(26)

Parametr ten podawany jest w katalogach dla zadanych umownie warunków granicznych; przy wzmocnieniu jednostkowym (tj. w reżymie wtórnikowym) i poziomie wymuszenia równym maksymalnemu napięciu wyjściowemu (*output voltage swing*).

Do zespołu ograniczeń wnoszonych przez inherentne własności wzmacniacza, powodujących różnego rodzaju dystorsje przenoszonego sygnału i pociągające w konsekwencji konieczność wprowadzenia odpowiedniego kondycjonowania, zaliczają się nadto – żeby wymienić tylko najważniejsze - przeciążalność amplitudowa (*overloading*), efekt spiętrzania impulsów (*pile-up effect*) oraz przesunięcie linii zerowej (*base-line shift*).

Mianem *przeciążalności amplitudowej* określane są efekty przesterowania wzmacniacza sygnałem (impulsem) o amplitudzie przekraczającej znacznie zakres przenoszenia liniowego. Pierwotnym skutkiem przeciążenia amplitudowego jest głęboka dystorsja wywołującego go impulsu. Z przekroczeniem poziomu nasycenia wiąże się w pierwszym rzędzie ograniczenie poziomu odpowiedzi, po wtóre zaś poszerzenie impulsu uwarunkowane procesami akumulacji i wyciągania nadmiarowych nośników ładunku z bazy tranzystora. Nadto wobec pojem-nościowego sprzężenia stopnia wzmacniającego ze źródłem wymuszenia oraz silnej zależności jego impedancji wejściowej od poziomu sygnału pojawia się bardzo głęboki i rozległy przerzut ujemny (*undershoot*) wprowadzający ten stopień w stan odcięcia. Powoduje to skutek wtórny, jakim jest przejściowa blokada (*paraliż*) toru transmisyjnego dla następnych w kolejności nie przeciążających impulsów ciągu. Wydłuża go dodatkowo ewentualny przerzut dodatni (*overshoot*) formowany w przypadku podwójnego różniczkowania sygnału. Te szkodliwe efekty ilustruje poglądowo rysunek 5, na którym obok odpowiedzi na impuls



Rys.5. Diagramy odpowiedzi na impuls przeciążający (1) i nieprzeciążający (2).

przeciążający (1) uwidoczniono również przebieg odpowiedzi na impuls mieszczący się w zakresie przenoszenia liniowego (2). Symbolem T_{rec} oznaczono interwał niedrożności toru dla kolejnych (nieprzeciążających) impulsów. Po jego upływie układ wraca do normalnego stanu aktywnego, co dało asumpt do nazwania go *czasem powrotu* (ang. *recovery time*). Jako parametr znamionowy wzmacniacza, *czas powrotu* określany jest dla założonej krotności przeciążenia; zwykle 100-krotnego względnie rzadziej 500-krotnego.

Ze stochastycznego charakteru ciągu impulsów formowanych na wyjściu detektora wynika, że mogą się one losowo zbliżać na odległość, przy której zachodzić będzie ich wzajemne nakładanie (przekrywanie). Zjawisko takie nosi nazwę *efektu spiętrzania impulsów*. W zależności od średniej częstości impulsów ciągu i ich rozciągłości czasowej spiętrzenia obejmować mogą bądź tylko pary bezpośrednio sąsiednich impulsów bądź też ich liczniejsze "paczki". W spektrometrycznym torze pomiarowym, stosownie do "procesowania" sygnału, spiętrzenia przybierają różną formę; zawsze jednak prowadzą do poszerzenia linii spektralnej czyli pogorszenia zdolności rozdzielczej systemu. Nieco odmienny jest również mechanizm degradacji rozdzielczości energetycznej w dwu podstawowych blokach wzmacniających: przedwzmacniaczu i sprzężonym z nim pojemnościowo wzmacniaczu głównym. Wynika on z charakteru nakładania się impulsów. W przedwzmacniaczu zachodzi ono na opadającej krawędzi impulsu podstawowego ("na ogonie"), natomiast we wzmacniaczu głównym – w przeważającej mierze na jego ujemnym przerzucie. Obydwa przypadki ilustruje rysunek 6.



Rys.6. Ilustracja spiętrzeń: (1) - "na ogonie", (2) – na przerzucie.

W pierwszym przypadku wysokość kolejnego impulsu nachodzącego na impuls poprzedzający (mierzona względem stałego potencjału "masy") - wzrasta, w drugim natomiast – maleje. Wielkość dewiacji amplitudy zależy w sposób oczywisty od głębokości pokrywania się impulsów, ta zaś ma charakter zupełnie przypadkowy. Stąd też wynika określony rozkład dystorsji amplitud podlegającego pomiarowi ciągu impulsów.

Bezpośrednim skutkiem spiętrzenia impulsów **monopolarnych** w przedwzmacniaczu jest losowe ich przemieszczanie w obszary charakterystyki przejściowej o różnej *nieliniowości różniczkowej*. Sprawia to, że przy różnych częstościach impulsów doznają one różnej dystorsji amplitudy powodując w ostatecznym efekcie odpowiednie zróżnicowanie posze-rzenia linii widmowej spektrogramu.

Zauważmy, że sygnał $V_S(t)$, stanowiący nieskończony ciąg identycznych impulsów $V_{imp}(t)$ o losowych wzajemnych odległościach t_i

$$V_{s}(t) = \sum_{i} V_{imp}(t - \underline{t_{i}})$$
(27)

można przedstawić jako superpozycję składowej stałej $\langle V_S \rangle$ oraz fluktuacyjnej składowej zmiennej o dyspersji σ Wielkości te opisane są odpowiednio przez I i II twierdzenie

Campbella-Francisa [11,6]. W przypadku typowego impulsu $V_{imp}(t) = V_{max}exp(-t/\tau)$ przyjmują one postać

$$\langle V_S \rangle = V_{max} \tau \langle f \rangle$$
(28)

oraz

$$\sigma = V_{max} \sqrt{\frac{\tau < f >}{2}}$$
(29)

Ukazują one w sposób jawny zależność obu tych wielkości od średniej częstotliwości repetycji $\langle f \rangle$, silniejszą – jak widać – w odniesieniu do średniego poziomu. Opisaną równaniem (28) wartość średnią sygnału można traktować jako obciążony fluktuacjami (29) bieżący poziom bazowy (ang. *base-line*). Jego przebiegi ilustruje rysunek 7 przedstawiający na tle charakterystyki przenoszenia stopnia wzmacniającego dwa diagramy spiętrzonych ciągów identycznych impulsów o różnych wartościach średniej częstości repetycji.

Bieżąca *wartość średniego poziomu* $\langle V_S \rangle$ oraz jego *dyspersja \sigma* wyznaczają (z różną wagą) "strefę roboczą" charakterystyki przejściowej, a w konsekwencji wielkość związanych z nią *zniekształceń nieliniowych*. Tak na przykład górny przebieg z rysunku 7 zdominowany jest wpływem średniego poziomu, wkraczającego w tym krańcowym przypadku w obszar nasycenia charakterystyki V_i - V_o .



Rys.7. Efekty spiętrzenia ciągów identycznych impulsów o różnych średnich częstotliwościach repetycji.

Wzmacniacz główny sprzężony jest z przedwzmacniaczem za pośrednictwem obwodu różniczkującego skracającego impuls wejściowy do wartości przy której prawdopodobieństwo spiętrzania *na ogonie* zostaje drastycznie zredukowane. Dominującym jest wówczas efekt alternatywny – nachodzenie kolejnych impulsów na *ujemny przerzut* impulsów poprzedzających. Jego bezpośrednim skutkiem jest *depresja* poziomu bazowego impulsów. Oznacza to, że pomiar amplitudy impulsów dokonywany względem ustalonego *poziomu referencyjnego* (w większości analizatorów amplitudy niemal z reguły względem potencjału *masy*) obarczony jest błędem wynikającym z fluktuacji linii bazowej. W dalszej konsekwencji efekt ten powoduje określone rozmycie (dyspersję) linii spektralnej. Można ją obliczyć korzystając, podobnie jak poprzednio, z II prawa Campbella-Francisa. Dla uproszczenia obliczeń przyjmiemy za *Fairsteinem* [13] uproszczoną postać wyodrębnionego przebiegu przerzutu $V^-(t)$

$$V^{-}(t) = V_{max}^{-} e^{-\frac{t}{\tau}} = V_{max}^{+} \left(\frac{\tau_{d}}{\tau}\right) e^{-\frac{t}{\tau}}$$
(30)

gdzie τ_d jest stałą czasową obwodu różniczkującego, τ - stałą czasową zaniku impulsu pierwotnego, a V_{max}^+ - amplitudą lobu dodatniego. Wyznaczona w ten sposób zależność

$$\sigma = \frac{\tau}{\tau_d} \left(\frac{\langle f \rangle \tau}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$$
(31)

funkcjonuje z dokładnością ok. 5% przy założeniu, że że stała czasowa obwodu różniczkującego τ_d jest co najmniej dziesięciokrotnie niższa od stałej czasowej τ .

2.2. Metody i układy kondycjonowania sygnału.

2.2.1. Wzmacniacze.

Ze względu na bardzo niski poziom sygnału generowanego w detektorach promieniowania jonizującego, podstawową operacją w procesie jego kondycjonowania jest wzmacnianie. Służące temu celowi układy kojarzone są w spektrometrycznym torze pomiarowym w kaskady zespołu sekcji wzmacniających i formujących zmontowane w dwu konstrukcyjnie rozdzielonych blokach funkcjonalnych: **przedwzmacniaczu** i **wzmacniaczu głównym**. Ich uzupełnieniem (w systemach wysokiej rozdzielczości) jest autonomiczny wzmacniacz o *regulowanej strefie aktywne*j umożliwiający wybiorczy pomiar części pełnego widma promieniowania, zwany potocznie **wzmacniaczem okienkowym** lub **ekspanderem**.

Problematyka przedwzmacniaczy została dostatecznie szeroko naświetlona w bliźniaczej monografii dotyczącej *układów elektroniki "Front-End"* [6]; w niniejszej ograniczymy się zatem tylko do zagadnień związanych z własnościami i realizacją wzmacniaczy głównych oraz okienkowych.

Podstawowe wymagania stawiane tego rodzaju wzmacniaczom wynikają ze stawianych im zadań, stosownie do ich wykorzystania w spektrometrii amplitudowej, czasowej bądź w układach selekcji impulsów według kształtu. Niezależnie od przeznaczenia każdy wzmacniacz winien charakteryzować się *niskim poziomem szumów własnych oraz indukowanych zakłóceń wewnętrznych, dużą odpornością na indukowane zakłócenia zewnętrzne*, oraz *wysoką stabilnością termiczną i długoterminową*. Tego rodzaju własności są wspólne dla wszelkiego rodzaju wzmacniaczy pomiarowych, toteż stosowane tam środki techniczne dla ich uzyskania znajdują również zastosowanie we wzmacniaczach spektrometrycznych.

W obszarze spektrometrii amplitudowej żąda się nadto *bardzo dobrej liniowości przenoszenia wzmacniacza* oraz *odporności na przeciążenia amplitudowe* i *efekt spiętrzania impulsów*. Spektrometria czasowa nakłada z kolei wymagania na *pasmo przenoszenia* wzmacniacza warunkujące osiągnięcie *wysokiej rozdzielczości czasowej*. W systemach selekcji impulsów według kształtu niezbędne jest wreszcie zachowanie *nieskażonej formy impulsu* pierwotnego (pełnego impulsu prądowego względnie czoła impulsu napięciowego).

Inherentna nieliniowość charakterystyki przenoszenia prostej sekcji wzmacniającej podyktowana jest wyłącznie nieliniowością jej elementów układowych, w szczególności zaś elementów aktywnych. Można ją wydatnie zredukować bądź to ingerując w mechanizm zniekształceń nieliniowych w konkretnych elementach układowych bądź – o wiele skuteczniej – przez objęcie układu pętlą (pętlami) ujemnego sprzężenia zwrotnego.

Pierwszy sposób znalazł praktyczny wyraz w odniesieniu do nieliniowości powodowanej zależnością transkonduktancji g_m tranzystora od (zależnego od poziomu sygnału wejściowego) prądu kolektorowego I_{K} . Naturalnym niejako w tym aspekcie środkiem zaradczym jest stabilizacja prądu kolektora zrealizowana w dwóch wersjach: jako stopień z obciążeniem *wy*-

soką impedancją dynamiczną (tzw. układ *botstrap*) względnie źródłem prądowym [12]. Na rysunku 8 (a i b) zamieszczono - dla przypomnienia - obydwie te konfiguracje.



Rys. 8. Schematy stopni wzmacniających o podwyższonej liniowości 8a) Układ typu "bootstrap" 8 b) Układ z obciążeniem źródłem prądowym

W obu konfiguracjach zastosowano kaskadę *OE-OC* zrealizowaną odpowiednio na tranzystorach T_1 i T_2 . W układzie pierwszym dodatnie sprzężenie zwrotne z wyjścia wtórnika T_2 via C_F do węzła "*Y*" gałęzi rezystorowej R_{KI} i R_{K2} obwodu obciążenia T_1 "powtarza" w tym węźle przebieg napięciowy pojawiający się w węźle "*X*" zapobiegając zmianom prądu kolektora tranzystora T_1 . Nietrudno wykazać [6], że efektywne obciążenie tego tranzystora stanowi *impedancja dynamiczna* określona formułą

$$Z_{DYN} \cong R_{DYN} \cong \frac{R_{K1}}{1 - K_{V2}}$$
(32)

gdzie K_{V2} oznacza wzmocnienie napięciowe wtórnika wyjściowego (T_2). Zważywszy, że wzmocnienie napięciowe wtórnika jest bardzo bliskie jedności uzyskuje się odpowiednio silne zwielokrotnienie oporności obciążenia przeciwdziałające zmianom prądu w tym obwodzie podczas trwania impulsu.

Zastąpienie w obwodzie kolektora stopnia *OE* rzeczywistej rezystancji obciążenia źródłem prądowym w oczywisty sposób czyni zadość wymaganiu stałości prądu kolektorowego T_1 . Tę własność wykorzystano właśnie w alternatywnej wersji stopnia wzmacniającego przedstawionej na rysunku 8b), w którym funkcję źródła prądowego pełni komplementarny tranzystor T_3 .

W układach wielostopniowych poprawę liniowości sekcji wzmacniającej uzyskuje się dzięki stosowanemu w niej w reguły *ujemnemu sprzężeniu zwrotnemu*. Dla ilościowego określenia stopnia polepszenia liniowości sekcji wzmacniającej skorzystamy z ogólnej definicji nieliniowości względnej ε (wiążącej odpowiedzi na wymuszenie V_i według charakterystyki rzeczywistej $V_{o.rzecz}$ i charakterystyki idealnej $V_{o.ideal}$)

$$\varepsilon(V_i) \stackrel{def}{=} \left(\frac{\Delta V_o}{V_o}\right)_{V_i} = \left(\frac{V_{o\ rzecz} - V_{o\ ideal}}{V_{o\ rzecz}}\right)_{V_i}$$
(33)

rozumianej jako parametr "lokalny", będący funkcją napięcia wejściowego V_i . Zauważmy, że na gruncie tej definicji wprowadzono podany uprzednio parametr "globalny" ε_i

Uwzględniając w równaniu (33) oczywiste zależności

$$K_{ideal} \stackrel{def}{=} \frac{V_{oideal}}{V_i} , \qquad K_{rzecz} \stackrel{def}{=} \frac{V_{orzecz}}{V_i}$$
(34)

jak również

$$V_{orzecz} = V_{oideal} + \Delta V_o \tag{35}$$

w wyniku prostych przekształceń otrzymamy formułę ukazującą zależność rzeczywistego współczynnika wzmocnienia K_{rzecz} od napięcia wejściowego V_i .

$$K_{rzecz}(V_i) = \frac{K_{ideal}}{\left[1 - \varepsilon(V_i)\right]} \underset{\varepsilon \ll 1}{\cong} K_{ideal} \left[1 + \varepsilon(V_i)\right]$$
(36)

W rezultacie wprowadzenia do układu wzmacniacza obwodu ujemnego sprzężenia zwrotnego o transmitancji β efektywne jego wzmocnienie ulega redukcji do poziomu

$$K_{F\,rzecz} = \frac{K_{rzecz}}{1 + \beta K_{rzecz}} \tag{37}$$

Kojarząc zatem wyrażenia (36) i (37) dochodzimy do związku o strukturze formuły (36)

$$K_{F \, rzecz}(V_i) = \frac{K_{ideal}}{1 + \beta K_{ideal}} \left\{ 1 + \frac{\varepsilon(V_i)}{1 + \beta K_{ideal} [1 + \varepsilon(V_i)]} \right\}$$
(38)

Drugi składnik sumy w dużym nawiasie powyższej zależności reprezentuje ekwiwalentny współczynnik nieliniowości ε_{eff} . Jak łatwo zauważyć, skutek działania ujemnego sprzężenia zwrotnego manifestuje się ponad $[1+\beta K_{ideal}]$ – krotnym zmniejszeniem "naturalnej" nieliniowości ε wzmacniacza. Podlegają mu oczywiście również nieliniowość całkowa ε_i i różniczkowa ε_d . Minimalizacja nieliniowości tą metodą jest szczególnie efektywna w przypadku użycia jako sekcji wzmacniających wzmacniaczy operacyjnych o bardzo wysokim wzmocnieniu i szerokim paśmie przenoszenia, stosowanych w większości współczesnych impulsowych wzmacniaczy spektrometrycznych. Wzmacniacze te niemal z reguły wykonywane są w konfiguracji z wejściem symetrycznym (*differential input*) i asymetrycznym wyjściem (*single ended output*).

Okazują się one wielce korzystne ze względu na *dużą odporność na przeciążenie amplitudowe*. W technice tranzystorowej zapewnia ją wejściowy stopień różnicowy o sprzężeniu emiterowym na dużej rezystancji obciążenia (tzw. *Long Tailed Pair* - **LTP**); najczęściej z obciążeniem źródłem prądowym. W technice lampowej odpowiada mu podobny strukturalnie stopień o sprzężeniu katodowym. Warto przypomnieć, że taki właśnie układ został praktycznie wykorzystany w konstrukcji nieprzeciążalnych wzmacniaczy spektrometrycznych już przed 50-laty [13], a dopiero kilkanaście lat później pojawiły się jego implementacje półprzewodnikowe.

Na rysunku 9 przedstawiono schemat ideowy opracowanej w tych latach tranzystorowej wersji sekcji wzmacniającej według projektu *B.Collinge'a* [14]. Jest to dwustopniowy układ z czysto rezystywnym obwodem ujemnego sprzężenia zwrotnego. W stopniu wejściowym zawiera on dwójkę symetryczną o sprzężeniu emiterowym (LTP) na selekcjonowanych tranzystorach typu 2N911 zmontowanych fabrycznie we wspólnej obudowie, oznaczonej symbolem SP8303. W drugim stopniu pracującym w układzie *WE* zastosowano komplementarny tranzystor 2N726. Sam układ wykazuje odporność na 100-krotne przeciążenie amplitudowe. Struktura jego stopnia wyjściowego zapobiega nadto przeciążeniom kolejnych sekcji wzmacniacza, ograniczając poziom jego odpowiedzi wskutek blokowania stopnia *WE* - dla impulsów dodatnich, oraz obcinającym działaniem, *kotwiczonej* na potencjale masy, dio-dy SX11 - dla impulsów ujemnych.



Rys. 9. Stopień "nie przeciążalny" wg. Collinge'a

Sekcje wzmacniające współczesnych wzmacniaczy spektrometrycznych stanowią w istocie rozwinięcie powyższej konfiguracji. Przykładowymi rozwiązaniami w kategorii układów na elementach dyskretnych są sekcje wzmacniające popularnych wzmacniaczy: Mod. WL-41 (produkcji krajowej) [15] oraz Mod. TC-220 BLR (f-my TENNELEC) [16]. Pierwszy z wymienionych, wzorowany jest na układzie wzmacniacza ORTEC – Model 716 [17]. Schemat ideowy jego sekcji wejściowej ukazuje rysunek 10.



Rys. 10. Sekcja wejściowa wzmacniacza WL-41

W pierwszym stopniu zastosowano tu konwencjonalny układ LTP z rezystorową gałęzią emiterową, wykorzystując do sterowania drugiego stopnia sygnały z obu wyjść pary różnicowej. W konfiguracji tej tranzystor wyjściowy T_4 sterowany jest równocześnie w obwodzie

bazy (sygnałem z T_2) jak i emitera (sygnałem z T_1 via wtórnik T_3). Dla sygnału odbieranego z obwodu kolektora T_1 pracuje on zatem w układzie *WB*, natomiast dla sygnału odbieranego z obwodu kolektora T_2 – w układzie *WE*. Wypadkowe wzmocnienie sekcji jest więc równe sumie wzmocnień obu gałęzi sygnałowych: $(T_1 \div T_3 \div T_4)$ oraz $(T_2 \div D_{1,2} \div T_4)$. Różnicowy stopień wejściowy zapewnia dużą odporność sekcji na przeciążenie amplitudowe. Jest ono nadto wspomagane działaniem diod $D_{1,2}$ i D_3 , zabezpieczających tranzystory T_3 i T_4 przed wejściem w stan nasycenia. Dane znamionowe wzmacniacza WL-41 określają jego *nieprzeciążalność* amplitudową podając wartość czasu powrotu T_{REC} po 30-krotnym przeciążeniu. Jest ona równa 2,5 krotnej szerokości maksymalnego, nieprzeciążającego impulsu wyjściowego na poziomie 2% jego amplitudy ($t_{2\%}$). Sekcja objęta jest stałoprądowym, ujemnym sprzężeniem zwrotnym stabilizującym pracę sekcji i determinującej wartość jej wzmocnienia. W obu gałęziach wejściowych tej sekcji zastosowano ograniczniki diodowe zabezpieczające układ przed skutkami ewentualnego przekroczenia poziomu dopuszczalnego napięcia wejściowego.

Rysunek 11 przedstawia z kolei pełny schemat ideowy wejściowej sekcji wzmacniającej impulsowego wzmacniacza liniowego TC-220 BLR [16].



Rys. 11. Sekcja wejściowa wzmacniacza TENNELEC Mod. TC 220 BLR-20

Podobnie jak poprzednie, zawiera ona na wejściu stopień różnicowy (T_1, T_2) o sprzężeniu emiterowym, jednak w tym przypadku zamiast rzeczywistego rezystora we wspólnym obwodzie emiterów zastosowano źródło prądowe (T_3, T_4). Jego wysoka impedancja dynamiczna podnosi w efekcie odporność przeciążeniową stopnia LTP. Kolejne stopnie sekcji warunkują osiągnięcie wymaganego wzmocnienia (w otwartej pętli), szerokiego pasma przenoszenia, minimalnych zniekształceń nieliniowych oraz niskiej impedancji wyjściowej. Zrealizowano je w kaskadzie subukładów: stopień *WB* (T_5) (tworzący n.b. wespół z poprzedzającym go tranzystorem dwójki LTP układ kaskodowy) obciążony źródłem prądowym (T_6) oraz niekonwencjonalna kaskada komplementarnych wtórników wyjściowych ($T_7 \div T_{10}$). Należy podkreślić, że istotną funkcję w kaskadzie wtórnikowej pełni diodowo-pojemnościowa ($D_7 \div C_o$) gałąź łącząca emitery końcowej pary. Poprawia ona własności układu przy przenoszeniu słabych sygnałów zachowując jego odporność na przeciążenie częstotliwościowe [16]. Cała sekcja objęta jest stałoprądową pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego. Ważną rolę w układzie pełni zapięta w punkcie *masy pozornej* (oznaczonym na schemacie symbolem Σ) gałąź dwu przeciwstawnie połączonych diod D_1 i D_2 . Zapobiegają one wzrostowi impedancji wejściowej sekcji w przypadku silnego przeciążenia amplitudowego blokującego działanie obwodu sprzężenia zwrotnego, skracając w rezultacie *czas powrotu* T_{REC} sekcji ze stanu przeciążenia. W analogicznej, choć nieco uproszczonej konfiguracji wykonano pozostałe sekcje wzmacniające, wykorzystywane zresztą również w strukturach filtrów aktywnych tego wzmacniacza.

Najnowsze realizacje impulsowych wzmacniaczy spektrometrycznych coraz częściej sięgają do techniki układów scalonych. Stosują one bądź to układy scalone ogólnego przeznaczenia [18] bądź też wykonywane specjalnie dla potrzeb pomiarów spektrometrycznych monolityczne lub hybrydowe układy scalone (np. [19]), zaliczane do kategorii mikroukładów "ASIC" – (*Application Specified Integrated Circuits*). Rysunek 12 przedstawia przykładowy schemat aplikacyjny wykorzystania scalonego wzmacniacza operacyjnego µA715 w charakterze sekcji wzmacniającej wzmacniacza liniowego systemu CAMAC typu 1101. Jak łatwo zauważyć, również w tym przypadku dla poprawy własności przeciążeniowych sekcji zastosowano diodę bocznikująca wejście odwracające wzmacniacza.



Rys.12. Sekcja wzmacniacza "CAMAC" 1101

Wzmacniacz 1101 zawiera dwie tego rodzaju sekcje wzmacniające o wzmocnieniach napięciowych $K_{V2}=16$ i $K_{V4}=18$, uzupełnione trzema stopniami tranzystorowymi: wejściowym, separującym i wyjściowym o wzmocnieniach wynoszących odpowiednio $K_{V1}=2$, $K_{V3}=1$ oraz $K_{V5}=7$. Jego własności przeciążeniowe determinują krotność przeciążenia dla czasu powrotu T_{REC} (wyznaczanego według kryterium 2,5 $t_{2\%}$) na poziomie 200 dla impulsów monopolarnych oraz 1000 dla impulsów bipolarnych. Techniczne warunki stabilności pracy sekcji objętych pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego narzucają ograniczenie ich wzmocnienia (na ogół poniżej 25 dB). Dla uzyskania pożądanego wzmocnienia wzmacniacza niezbędne jest zatem użycie kilku sekcji wzmacniających. W ich kaskadę w strukturze wzmacniacza spektrometrycznego włączone są nadto układy filtrów determinujących pasmo jego przenoszenia. Dla przykładu na rysunku 13 przedstawiono schematycznie wzajemne usytuowanie sekcji wzmacniających i filtrów w strukturze wzmacniacza typu 1101.



Rys.13. Schemat blokowy struktury wzmacniacza CAMAC 1101

Z punktu widzenia kształtowania pasma przenoszenia lokalizacja jak i kolejność filtrów może być zupełnie dowolna. Umiejscowienie górno-przepustowego filtru skracającego (PZC) na wejściu wzmacniacza tuż za jego stopniem buforowym zmniejsza wydatnie prawdopodobieństwo spiętrzania impulsów (*pile-up effect*) w kolejnych sekcjach wzmacniających. W tym również celu filtr dolnoprzepustowy FA (w danym przypadku zrealizowany w formie filtru aktywnego *Sallena Key'a* [20]) przesunięto jak najbliżej wyjścia. Poprzedzająca go partia sekcji wzmacniających zwana jest potocznie "szybką" podczas gdy część zawierająca sam całkujący filtr aktywny (*integrator*) oraz kolejne subukłady (*obwód drugiego różniczkowania i wzmacniacz wyjściowy*) określane są mianem części "wolnej". W większości nowszych konstrukcji wzmacniaczy spektrometrycznych w skład sekcji "wolnych" wchodzi również układ *przywracania linii zerowej* BLR – (ang. *base-line restorer*).

Impuls uzyskiwany na wyjściu sekcji "szybkich" wykorzystywany jest często w stowarzyszonych pomiarach czasowych. Zadaniem sekcji wejściowej i wyjściowej jest dopasowanie wzmacniacza odpowiednio do źródła sygnału (przedwzmacniacza) oraz odbiornika sygnału wzmocnionego (układu ekstrakcji informacji). Regulacja wzmocnienia wzmacniacza dokonywana jest skokowo przy pomocy kalibrowanych tłumików "T" oraz płynnie potencjometrem "P". Taki sam sposób regulacji wzmocnienia zastosowano we wzmacniaczu typu WL-41. Alternatywą dla tej metody jest przełączanie rezystancji w obwodzie ujemnego sprzężenia zwrotnego [16,17,19].

Globalnym parametrem opisującym jakość systemu spektrometrycznego jest jego zdolność rozdzielcza. W obszarze spektrometrii amplitudowej określa ją jednoznacznie stosunek amplitudy impulsu wyjściowego do wartości średniej kwadratowej napięcia szumów wyjściowych zwany potocznie *stosunkiem sygnału do szumu* SNR (ang. *Signal-to-Noise Ratio*), natomiast w dziedzinie spektrometrii czasowej – stosunek nachylenia czoła impulsu wyjściowego do średniej kwadratowej wartości napięcia szumów wyjściowych, zwany krótko *stosunkiem nachylenia do szumu* SLNR (ang. *Slope-to-Noise Ratio*). Formalnie na wielkość tę możemy wpływać zarówno poprzez minimalizację szumów jak też przez zwiększanie stromości czoła impulsu. Dominujące znaczenie ma jednak stromość czoła. Dla spełnienia tego podstawowego wymagania wzmacniacz główny winien odznaczać się dużą szybkością reakcji, a jego *własny czas narastania t_n* winien być znacząco krótszy od czasu narastania impulsu wejściowego. Stosownie do takich wymagań opracowano nową klasę wzmacniaczy dedykowa-

nych specjalnie do pomiarów czasowych, określanych w terminologii anglosaskiej nazwami *timing amplifiers* względnie *timing filter amplifiers* [21].

Ogólny podział szybkich wzmacniaczy impulsowych klasyfikuje je według techniki kojarzenia stopni wzmacniających wyróżniając *wzmacniacze addytywne*, których wzmocnienie całkowite jest sumą wzmocnień poszczególnych stopni, oraz *wzmacniacze multyplikatywne*, o wzmocnieniu globalnym równym iloczynowi wzmocnień stopni składowych. Koncepcja wzmacniacza addytywnego [22] zrodziła się na gruncie ograniczeń techniki lampowej (niedostateczne pole wzmocnienia (GB) indywidualnego stopnia i degradacja wypadkowego pola wzmocnienia w konwencjonalnej kaskadzie wielostopniowej). Konfiguracja lampowa została transponowana do techniki półprzewodnikowej; z raczej mizernym skutkiem w realizacjach na tranzystorach bipolarnych i w miarę efektywnie w strukturach MOS'owskich. Dla przypomnienia zasady pracy wzmacniacza addytywnego na rysunku 14 przedstawiono schemat ideowy realizacji na tranzystorach polowych.



Rys.14. Schemat wzmacniacza o wzmocnieniu rozłożonym

Dwa łańcuchy linii opóźniających sprzęgają odpowiednio bramki i dreny zespołu tranzystorów tworzących sekcję wzmacniającą. Poprzez pierwszy (L_G - C_G) propaguje sygnał wejściowy, przez drugi natomiast (L_D . C_D) odpowiedzi stopni (sygnał wzmocniony). Przy zachowaniu identycznych wartości opóźnień transmisyjnych ($t_{opD}=t_{opG}$) obu linii odpowiedź każdego kolejnego stopnia sumuje się z odpowiedzią wszystkich stopni poprzedzających. W tym kontekście można mówić o rozłożeniu wzmocnienia wzmacniacza na składniki addytywne. Fakt ten dał asumpt do określania *wzmacniacza addytywnego* również mianem *wzmacniacza o wzmocnieniu rozłożonym*. W praktyce przyjęła się nadto nazwa *wzmacniacz łańcuchowy* znajdująca uzasadnienie w jego specyficznej strukturze. Wzmacniacz łańcuchowy pozwala osiągnąć wymagane wzmocnienie przy częstotliwości przewyższającej wartość *pola wzmocnienia poszczególnych stopni*. Stanowi to jego niezaprzeczalną wyższość nad konwencjonalnymi układami kaskadowymi typu *multyplikatywnego*. W przypadku zespołu *n* identycznych stopni globalne wzmocnienie wzmacniacza $K_{V\Sigma}$ wyniesie

$$K_{V\Sigma} = n \ K_{Vi} = n \left(g_m \frac{Z_{0D}}{2} \right) = \frac{1}{2} \ n \ g_m \ \sqrt{\frac{L_D}{C_D}}$$
(39)

przy czym: K_{Vi} oznacza wzmocnienie indywidualnego stopnia, g_m – transkonduktancję tranzystora polowego, zaś Z_{0D} – impedancję charakterystyczną linii w obwodzie drenów.

Istotną wadą wzmacniaczy łańcuchowych jest niezadowalająca stabilność ich wzmocnienia, co praktycznie wyeliminowało je z zastosowań w systemach spektrometrycznych. Nowe możliwości aplikacyjne otwarły się natomiast przed *wzmacniaczami multyplikatywnymi* wobec pojawienia się nowych półprzewodnikowych elementów aktywnych o częstotliwościach granicznych sięgających zakresu gigahercowego. Istotną rolę w rozwoju szybkich wzmacniaczy impulsowych odegrały nowe koncepcje w zakresie ich projektowania. Szczególnie użyteczną i po dziś dzień powszechnie wykorzystywaną okazała się - zaproponowana przez *L.Scotta* - "technika projektowania integralnego" [23]. Polega ona na traktowaniu wielostopniowego w zasadzie układu jako jednej, *integralnej* jednostki funkcjonalnej. Realizacja założeń projektowych dokonywana jest w tej technice w oparciu o ogólną postać transmitancji tej jednostki. Dla zilustrowania procedur projektowych posłużymy się podręcznikowymi wręcz przykładami rozwiązań układowych. Tak więc rysunek 15 przedstawia konfigurację wzmacniacza napięciowego i jego uproszczony schemat zastępczy według projektu *Williamsa* i *Neilera* [24].



Rys.15. Szybki wzmacniacz napięciowy wg. *Williamsa* i *Neilera:* (a) schemat ideowy, (b) uproszczony schemat zastępczy.

Schemat zastępczy zaproponowanej konfiguracji jak również dokonana przez projektodawców analiza układu obciążone są szeregiem - dopuszczalnych wszakże - założeń upraszczających. Szczegółowe dane dotyczące tych uproszczeń znajdzie Czytelnik w powołanej wyżej pracy [24]; w niniejszym omówieniu ograniczymy się tylko do zacytowania wyprowadzonych tam zależności opisujących rezystancję wejściową R_i i transmitancję F(p) układu

$$R_i \cong \beta \left(r_{bb'} + R_e + \beta r_e \right) \tag{40}$$

$$F(p) = -\frac{\beta R_L}{r_{bb'} + r_{b'e} + \beta R_e} \frac{1}{\left(1 + p \frac{1}{\omega_1}\right) \left(1 + p \frac{1}{\omega_2}\right) \left(1 + p \frac{1}{\omega_3}\right)}$$
(41)

$$\omega_{1} \cong \frac{1}{C_{b'e} r_{b'e} [r_{bb'} / (r_{bb'} + r_{b'e} + \beta R_{e})]}$$
(42)

$$\nu_2 \cong \frac{1}{C_{b'e} r_e} \tag{43}$$

$$\omega_3 \cong \frac{1}{R_L C_o} \tag{44}$$

Na gruncie zależności (41-44) łatwo zauważyć, że przy raz przyjętym typie tranzystorów, procedury projektowania wzmacniacza sprowadzają się zasadniczo do doboru wartości R_e oraz R_L (Z_L) zapewniających osiągnięcie optymalnych własności impulsowych wzmacniacza. Dla wartości elementów układu podanych na jego schemacie ideowym (przy prądach emiterowych I_E =7 mA) wzmocnienie napięciowe wzmacniacza wyniosło K_V = 25.8dB, a czas narastania t_n = 2.8 ns. Analiza układu pominęła obwód kompensacji dwójnikowej (*shunt peaking*) z indukcyjnością L [25],[26], której wartość dobrano eksperymentalnie. Zaniedbano w niej również pojemność sprzęgającą wtórnik emiterowy (WK) z kaskodą (WE-WB).

W udoskonalonej wersji (t_n <2ns) tej konfiguracji [27], zaadaptowanej z kolei do "Szybkiego wzmacniacza" Typ 1501 produkcji krajowej [28], zamiast sprzężenia pojemnościowego wprowadzono zresztą bezpośrednie połączenie galwaniczne. Na rysunku 16 przedstawiono schemat jednej z sekcji wzmacniających tego wzmacniacza, wyposażonej nadto w układ skokowej regulacji wzmocnienia.



Rys.16. Schemat ideowy pierwszej sekcji wzmacniającej szybkiego wzmacniacza Typ.1501 (CAMAC) [28]

W miarę rozwoju technologii tranzystorów i uzyskiwania coraz większych wartości pola wzmocnienia (*GB*), w zespole czynników ograniczających szybkość wzmacniacza odpowiednio większego znaczenia nabiera inercyjność stowarzyszonej sieci elementów biernych. Efekt ten ujawnia się szczególnie silnie we wzmacniaczach napięciowych. Stąd też zrodziła się koncepcja alternatywnego układu z tranzystorami pracującymi jako wzmacniacze prądowe [29], gdy skrajnie niskie rezystancje wejściowe stopni składowych (w idealizowanym przybliżeniu przyjmowane za równe zeru) redukują stałe czasowe obwodów międzystopniowych do pomijalnie małych wartości.

Schemat takiego rozwiązania przedstawiono na rysunku 17. Stanowi go tandem dwu bloków funkcjonalnych: dwutranzystorowej *jednostki integralnej* (T_1 - T_2) oraz jednotranzystorowego *stopnia separującego* (T_3). Blok pierwszy wykonano w formie niekonwencjonalnej "dwójki" z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, w której transmisja sygnału zachodzi w układzie *WB-WK* natomiast sprzężenie zwrotne w układzie *WB-WE*. Fukcję stopnia separującego pełni konwencjonalny układ o wspólnej bazie, zapewniający wymaganą niską wartość rezystancji obciążenia poprzedzającej go "dwójki".



Rys.17. Schemat sekcji szybkiego wzmacniacza prądowego wg. Rusha [29]

Wzmocnienie prądowe *jednostki integralnej* $G_{1-2}(p)$ w ogólnym zapisie operatorowym przybiera postać

$$G_{1-2}(p) = \frac{G_1^{WB}(p)G_2^{WK}(p)}{1 + G_1^{WB}(p)G_2^{WE}(p)b(p)}$$
(45)

gdzie:

$$G_{1}^{WB}(p) = \frac{\alpha_{01}}{1 + p \frac{\alpha_{01}}{\omega_{T1}}}, \quad G_{2}^{WK}(p) = 1 + \frac{\beta_{02}}{1 + p \frac{\beta_{02}}{\omega_{T2}}}, \quad G_{2}^{WE}(p) = \frac{\beta_{02}}{1 + p \frac{\beta_{02}}{\omega_{T2}}}, \quad (46)$$

oraz

$$b(p) = \frac{Z_1(p)}{Z_1(p) + Z_2(p)} \stackrel{=}{=} \frac{R_1}{R_1 - R_2} = \frac{1}{G_0}$$
(47)

Przy założeniu, że $\alpha_{o1} = \alpha_{o2} = 1$ oraz $\beta_{01} >> 1$ i uwzględnieniu związków (46) i (47), funkcję operatorową wzmocnienia prądowego (45) można sprowadzić do postaci uproszczonej

$$G_{1-2}(p) = G_0 \frac{1 + p \frac{1}{\omega_{T2}}}{p^2 \frac{G_0}{(\omega_{T1} \omega_{T2})} + p \frac{G_0}{\omega_{T2}} + 1}$$
(48)

Funkcja powyższa reprezentuje zarazem prądową odpowiedź impulsową układu. Jej przebieg czasowy, zależnie od charakteru i położenia biegunów tej funkcji na płaszczyźnie zmiennej zespolonej, może wykazywać bądź to "wyskoki" czy oscylacje, względnie nadmierne "rozciągnięcie" inercyjne. Optymalny, wolny od wymienionych dystorsji przebieg uzyskuje się w przypadku *tłumienia krytycznego*, gdy funkcję operatorową odpowiedzi charakteryzuje para identycznych biegunów rzeczywistych. W rozważanym przypadku warunkiem *tłumienia krytycznego* jest wymaganie, aby

$$\omega_{T2} = G_0 \frac{\omega_{T1}}{4} \tag{49}$$

Uwzględniając ten warunek w mianowniku równania (48) otrzymujemy

$$G_{1-2}(p) = G_0 \frac{1 + p \frac{1}{\omega_{T_2}}}{\left(1 + p \frac{2}{\omega_{T_1}}\right)^2}$$
(50)

Postać ta okazuje się korzystną dla dokonania formalnych uproszczeń funkcji operatorowej globalnego wzmocnienia prądowego $G_{tot}(p)$ całego układu. Posłużymy się w tym celu znaną *metodą kompensacji biegun-zero* (PZC). Załóżmy dalej, że pole wzmocnienia ω_{T3} tranzystora T_3 będzie równe ω_{T2} przyjmując zarazem, że jego zwarciowy współczynnik wzmocnienia prądowego $\alpha_{03} = 1$. Wzmocnienie prądowe tego stopnia wyniesie zatem

$$G_{3}(p) = \frac{1}{1 + p \frac{1}{\omega_{T3}}} = \frac{1}{1 + p \frac{1}{\omega_{T2}}}$$
(51)

W konsekwencji całkowite wzmocnienie prądowe sekcji wzmacniającej przyjmie postać

$$G_{tot}(p) = G_{1-2}(p)G_{3}(p) = G_{o} \frac{1 + p \frac{1}{\omega_{72}}}{\left(1 + p \frac{2}{\omega_{71}}\right)^{2}} \frac{1}{1 + p \frac{1}{\omega_{72}}} = G_{0} \frac{1}{\left[1 + \left(\frac{4}{\omega_{71}}\right)p + \left(\frac{2}{\omega_{71}}\right)^{2}p^{2}\right]}$$
(52)

Skorzystamy z niej w celu wyznaczenia czasu narastania posługując się omówioną w rozdziale 2.1 *metodą momentów*. Zestawmy zatem współczynniki determinujące czas narastania według formuły (23).

$$a_{1} = 0 \qquad b_{1} = \left(\frac{4}{\omega_{T1}}\right)$$
$$a_{2} = 0 \qquad b_{2} = \left(\frac{2}{\omega_{T1}}\right)^{2}$$

aby ostatecznie otrzymać

$$t_n = \left\{ 2\pi \left[\left(\frac{4}{\omega_{T1}} \right)^2 - 2 \left(\frac{2}{\omega_{T1}} \right) \right] \right\}^{\frac{1}{2}} = \frac{2}{\sqrt{2} f_{T1}} = \frac{1.12}{f_{T1}}$$
(53)

Dodajmy, że wartość czasu narastania wyznaczona przez projektanta wzmacniacza metodą opartą na wymuszeniu skokowym wyniosła

$$t_n^* = \frac{0.99}{f_{T1}} \tag{54}$$

Obie metody dają więc wartości bardzo bliskie odwrotności częstotliwości f_{T1} . Dla zastosowanych w układzie typów tranzystorów uzyskano t_n na poziomie 1.25 ns.

W procesie kondycjonowania analogowego sygnału radiometrycznego specyficzną funkcję pełnią **wzmacniacze okienkowe** (ang. *biased amplifier, expander, window amplifier*). Zadaniem ich jest wzmacnianie wyłącznie takich impulsów, których amplituda mieści się w dokładnie określonym przedziale. W ten sposób można wyeksponować szczególnie interesujący fragment widma energetycznego, rozciągając go następnie przez odpowiednie wzmocnienie, na pełny zakres układu ekstrakcji informacji, w danym przypadku wielokanałowego analizatora amplitudy.

Pod względem strukturalnym wzmacniacz okienkowy tworzą trzy subukłady funkcjonalne: *obcinacz, wzmacniacz liniowy* i *ogranicznik*. Dla przypomnienia odwołajmy się do definicji wprowadzonych tu nowych pojęć. Tak więc mianem *obcinacza* określany jest układ, w którym odpowiedź (napięcie wyjściowe) jest liniową funkcją wymuszenia (napięcia wejściowego) poczynając od pewnego, założonego poziomu zwanego *poziomem odcięcia*, zachowując niezmienną wartość stałą (na ogół zerową) dla napięć wejściowych niższych od tego poziomu. *Ogranicznikiem* natomiast zwany jest układ o liniowej charakterystyce przenoszenia sięgającej jedynie pewnego poziomu granicznego, powyżej którego odpowiedź utrzymuje wartość stałą [30]. Operację ograniczania poziomu powierza się często sekcji wzmacniającej, wykorzystując w tym celu jej naturalną charakterystykę przenoszenia (nasycenie). Funkcję obcinacza pełni zwykle układ *dyskryminatora diodowego*. Rysunek 18 podaje schematycznie taką konfigurację, a zamieszczone na nim przebiegi impulsów: wejściowego i wyjściowego, ilustrują działanie układu – obcinanie impulsu u jego podstawy.



Rys.18. Schemat ideowy konfiguracji sterowanego obcinacza diodowego (a) oraz wyodrębnionego jego fragmentu (b).

Właściwy układ obcinający tworzy czwórnik diodowo-rezystorowy $D-R_L$. Pozostałe elementy pasywne pełnią funkcje pomocnicze względnie mają charakter parazytowy. W szczególności kondensator o dużej pojemności C_S , służy do separacji stałoprądowej obwodu źródła sygnału od obwodu źródła napięcia polaryzacji $(R_P - V_w)$ diody. Z kolei pojemność C_r jest rozproszoną pojemnością montażową. Dla przeanalizowania własności układu posłużmy się schematem jego istotnego fragmentu (b), przyjmując dla uproszczenia $V_w=0$. Zapiszmy oczywiste związki:

$$V_i = I\left(R_D + R_L\right) \tag{55}$$

$$R_D = \frac{kT}{q} \frac{1}{I} ln \frac{I + I_{So}}{I_{So}}$$
(56)

$$I = \frac{V_o}{R_t} \tag{57}$$

Pozwalają one napisać równanie odwrotne charakterystyki przejściowej układu $V_i = f(V_o)$

$$V_i = V_o + \frac{kT}{q} \ln\left(1 + \frac{V_o}{I_{So}R_L}\right)$$
(58)

Niestety uzyskana postać uchyla się od ponownego jej odwrócenia na drodze analitycznej. Wyznaczenia charakterystyki przejściowej można dokonać ma drodze obliczeń numerycznych bądź też manipulacji geometrycznych (ćwierć-obrót + przewrót) diagramami charakterystyk odwrotnych (58). Tym drugim sposobem sporządzono wykresy przedstawione na rysunku 19. Stanowią one rodzinę charakterystyk przejściowych układu przy różnych wartościach iloczynu $I_{So}R_L$



Rys.19. Rodzina charakterystyk przejściowych obcinacza diodowego $V_o = f(V_i)|_{R_L I_{So}}$ (1) $R_L I_{So} = 10^{-6}$; (2) $R_L I_{So} = 10^{-7}$; (3) $R_L I_{So} = 10^{-8}$; (4) $R_L I_{So} = 10^{-9}$; (5) $R_L I_{So} = 10^{-10}$; (6) wspólna charakterystyka w przypadku objęcia diody ujemnym sprzężeniem zwrotnym przy $WSZ = 10^4$

Dla zadanej (z oczywistych względów ekstremalnie niskiej) wartości prądu wstecznego I_{So} wyłącznym parametrem rodziny charakterystyk jest rezystancja obciążenia R_L . Patrząc pod tym kątem na powyższe charakterystyki łatwo zauważyć *efekt zwężania ich kolana* w miarę wzrostu rezystancji R_L . W opisie teoretycznym (58) znajduje on uzasadnienie postępującą redukcją drugiego składnika sumy "pod logarytmem". Na gruncie zależności (56) można go formalnie traktować jako zmniejszenie rezystancji diody R_D . Podobny skutek można osiągnąć poprzez włączenie diody obcinającej w pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego pomocniczego wzmacniacza operacyjnego. Dla założonych wartości wzmocnienia w otwartej pętli K_V oraz transmitancji pętli *b* rezystancja R_D redukuje się do wartości R_D^*

$$R_{D}^{*} = \frac{1}{(1+bK_{V})} \frac{kT}{q} \frac{1}{I} ln \left(\frac{I+I_{So}}{I_{So}}\right) \frac{1}{I+I_{S0}}$$
(59)

sprowadzając w rezultacie równanie odwrotne charakterystyki przejściowej do postaci

$$V_i = V_o + \frac{1}{\left(1 + bK_V\right)} \frac{kT}{q} \ln\left(1 + \frac{V_o}{I_{So}R_L}\right)$$
(60)

Wyznaczoną na jej podstawie (w analogicznych jak poprzednio procedurach) charakterystykę przejściową przedstawiono również na rysunku 19, gdzie oznaczono ją liczbą (6). Jej relacja w stosunku do rodziny j charakterystyk konwencjonalnych nie wymaga komentarza.

W analizie powyższej przyjęto zerową wartość napięcia polaryzacji spoczynkowej (V_w =0), stąd też punkt załamania charakterystyki sprowadzony został do tego poziomu. Przewidziana w układzie możliwość regulacji polaryzującego napięcia zaporowego pozwala w konsekwencji podnosić odpowiednio poziom odcięcia ($V_{odc}=V_w$).

Rysunek 20 przedstawia z kolei schemat konfiguracji układu obcinającego wykorzystującego technikę ujemnego sprzężenia zwrotnego. W układzie tym obok podstawowej pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego, zawierającej diodę obcinającą D_1 , wprowadzono drugą pętlę równoległą z przeciwstawnie włączoną diodą D_2 , której zadaniem jest tłumienie pojawiających się ewentualnie impulsów wejściowych przeciwnej polarności.



Rys.20. Ogólny schemat struktury wzmacniacza okienkowego.

Dla uproszczenia, na schemacie pominięto obwód ustalający spoczynkowy punkt pracy układu decydujący o poziomie odcięcia. O ile w układzie podstawowym z rysunku 18 stanowi go obwód *regulacji napięciowej* (R_p - V_w), to w wersji ze wzmacniaczem operacyjnym funkcję tę pełni obwód *regulacji prądowej* ze sterowanym (regulowanym) źródłem prądowym I_w . Zastosowanie wzmacniacza operacyjnego ewidentnie usprawnia operację obcinania, uzupełniając ją nadto działaniem ograniczającym, wynikającym – jak już wspomniano – z nasycenia inherentnej charakterystyki przejściowej wzmacniacza. Innymi słowy zmodyfikowany układ pełni w istocie funkcję *wzmacniacza okienkowego*. Idealizując jego własności można przedstawić jego pełną charakterystykę linią łamaną, jak to ukazano na rysunku 21. Punkty załama-



Rys.21. Charakterystyka przenoszenia idealnego wzmacniacza okienkowego

nia wydzielają trzy obszary pracy układu. W szczególności dla sygnałów o amplitudach $V_i < V_{odc}$ tor transmisji jest odcięty. Liniowo, ze wzmocnieniem K_{V2} przenoszone są nadwyżki sygnału ponad poziom odcięcia. Odpowiedź na sygnały wejściowe o amplitudach $V_i > V_{ogr}$ zachowuje natomiast wartość stałą, właściwą dla $V_i = V_{gr}$.

Na rysunku 22 przedstawiono dla przykładu schemat ideowy zaawansowanego rozwiązania fabrycznego wzmacniacza okienkowego. Stanowi on podstawową jednostkę funkcjonalną *bramkowanego wzmacniacza okienkowego (Gated Biased Amplifier)* ORTEC Model 444 [31]. Sterowane źródło prądowe typu 908-5 dostarcza w tym układzie prądu wstępnej polaryzacji ustalającego poziom napięcia progowego wzmacniacza V_w . Wartości rezystancji w obu gałęziach sprzężenia zwrotnego (R_{F1}, R_{F2}) oraz wejściowej rezystancji szeregowej (R_w) determinują wartość współczynnika wzmocnienia wzmacniacza, który dla warunku I_i - I_w >0, tj. dla stanu przewodzenia diody D_I równa się K_{FI} =1, zaś w przypadku przewodzenia diody $D_{2,}$ gdy I_i - I_w <0, wynosi K_{F2} =0.02. Funkcję ogranicznika pełni w tym układzie sam wzmacniacz operacyjny typu 908-4, wykorzystując w tym celu uwarunkowane efektem nasycenia górne zakrzywienie charakterystyki przenoszenia.



Rys.22. Schemat wzmacniacza okienkowego ORTEC Model 444.

Z zasady działania wzmacniacza okienkowego wynika, że wzmocnieniu podlega tylko ta część przenoszonego impulsu nie przekraczającego poziomu ograniczenia V_{ogr} , która przewyższa poziom progowy V_{odc} . Powoduje to w rezultacie skrócenie podstawy części przenoszonego impulsu istotnie zmieniając jego widmo częstotliwościowe i przesuwając go w stronę wyższych częstotliwości. Efekt zwężania impulsów ilustruje rysunek 23.



Rys.23. Ilustracja efektu zwężania impulsów na wyjściu wzmacniacza okienkowego

Dla liniowego przeniesienia uformowanych w ten sposób impulsów wyjściowych niezbędne jest zatem odpowiednie poszerzenie pasma przenoszenia następnych stopni wzmacniających. Alternatywą dla tego wymogu jest zastosowanie dodatkowych układów kondycjonujących, powodujących ponowne wydłużenie impulsów. Układy tego rodzaju zostaną przedstawione w następnym rozdziale monografii.